

# Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

## Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14091-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gültigkeitsdauer: 07.07.2011 bis 06.07.2016

Urkundeninhaber:

**nanoAnalytics GmbH**  
**Heisenbergstr. 11, 48149 Münster**

Prüfungen in den Bereichen:

**Rasterelektronenmikroskopische (REM) und energiedispersive röntgenspektroskopische (EDX)  
Untersuchungen von Oberflächen**

### **1 Untersuchungen von Oberflächen**

#### **1.1 Rasterelektronenmikroskopische Verfahren**

StAA S 1.001 2011-03	Vergleichende Abbildung und Vermessung von leitenden Oberflächen (z.B. Metallen und Metalllegierungen) mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM)
StAA S 1.001a 2011-03	Vergleichende Abbildung und Vermessung von nichtleitenden Oberflächen (z.B. Polymere, Keramiken, Gläser, Papier, Oxide) mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM)
StAA S 1.004 2011-03	Vergleichende Abbildung und Vermessung von biologischen Präparaten mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM)
StAA S 1.005 2011-03	Bestimmung von Partikelgrößen mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) in Anlehnung an ISO 17853 (2003): Wear of implant materials – Polymer and metal wear particles – Isolation, characterisation and quantification
StAA S 1.006 2011-03	Schichtdickenbestimmung an Querschnitten mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) in Anlehnung an DIN EN ISO 2808 (2007): Beschichtungsstoffe – Bestimmung der Schichtdicke

StAA S 1.007  
2011-03

Bestimmung der Schichtdicke in Anlehnung an DIN EN ISO 9220 (1994): Metallische Überzüge – Messen der Schichtdicke – Verfahren mit Rasterelektronenmikroskopie (REM)

## 1.2 Energiedispersive röntgenspektroskopische Verfahren

StAA S 1.101  
2011-03

EDX Analysen von leitfähigen Oberflächen (Analyse flächiger Bereiche)

StAA S 1.102  
2011-03

Lokale EDX Analysen von Partikel oder Einschlüssen

ASTM E1508-98  
(2008)

Standard Guide for Quantitative Analysis by Energy-Dispersive Spectroscopy

### verwendete Abkürzungen:

StAA StandardArbeitsAnweisung der nanoAnalytics GmbH  
ASTM American Society for Testing and Materials